

## 二、批准欧陆埃文思材料科技（上海）有限公司检验检测的能力范围

证书编号：260908341842

第 2 页 共 2 页

检验检测地址：上海市闵行区江凯路 1 7 7 号 2 号楼 1 楼 01 室，2 楼 01 室

| 序号   | 类别（产品/项目/参数） | 产品/项目/参数 |         | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号）                             | 限制范围或说明 |
|------|--------------|----------|---------|-------------------------------------------------|---------|
|      |              | 序号       | 名称      |                                                 |         |
| 一    | 半导体材料/高纯硅    | 1        | 选区电子衍射  | 微束分析 分析电子显微术 透射电镜选区电子衍射分析方法<br>GB/T 18907-2013  |         |
|      |              | 2        | 硅中硼深度剖析 | 表面化学分析 二次离子质谱<br>硅中硼深度剖析方法<br>ISO 17560：2014（E） |         |
| 以下空白 |              |          |         |                                                 |         |